Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/064,964	UBIK ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Ronald Laneau	3627	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
701	028	2/1/2006	RL
701	029	2/1/2006	RL
701	033	2/1/2006	RL
701	035	2/1/2006	RL
705	028	2/1/2006	RL
705	022	2/1/2006	RL

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
<u> </u>			:
	:		

(INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEGY	<u>()</u>
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		ļ